

番号：	SOM-EMS-16-00
作成日：	2022 年 8 月 1 日

ソフトウェア取扱説明書

EMS シリーズ

RCT-TEST 実行編

ソフトウェア取扱説明書	書 類 番 号	ページ
	SOM-EMS-16-00	2 / 12

■履歴

改 訂	作 成 日	内 容
---	2022/8/1	新 規 作 成
1		
2		
3		
4		
5		

■目 次

1. CLF 測定について 3

2. CLF 測定を行う..... 4

2.1 実行画面を開く 4

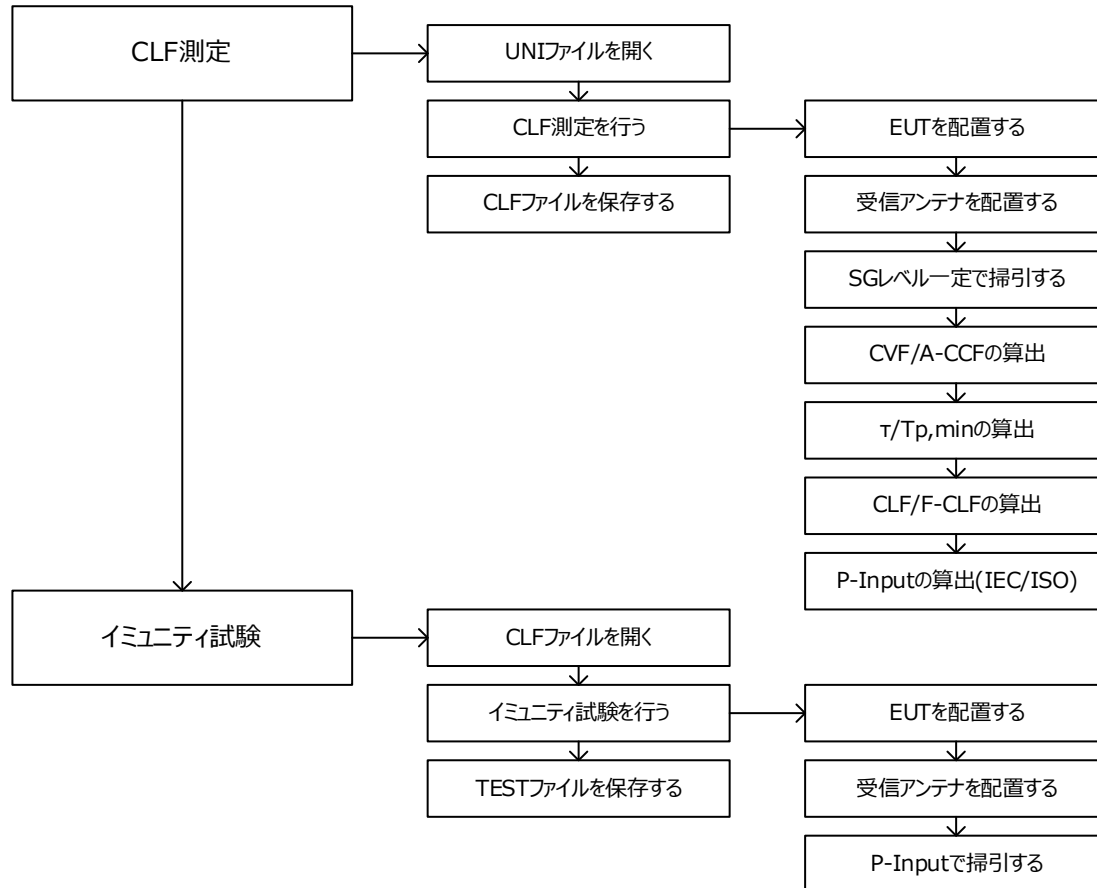
2.2 画面構成..... 4

2.3 測定の実行 10

1. TEST について

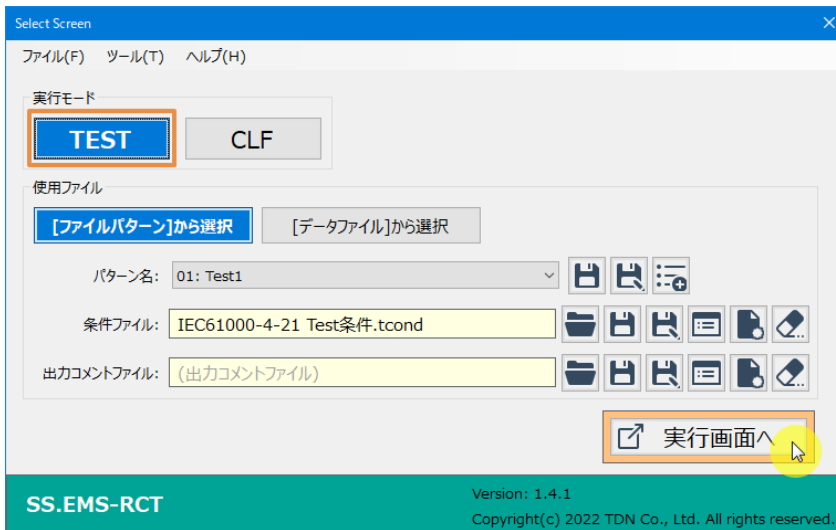
TEST は CLF 測定後の CLF データファイルを使用して行います。

■ RCT における TEST フロー



2. CLF 測定を行う

2.1 実行画面を開く

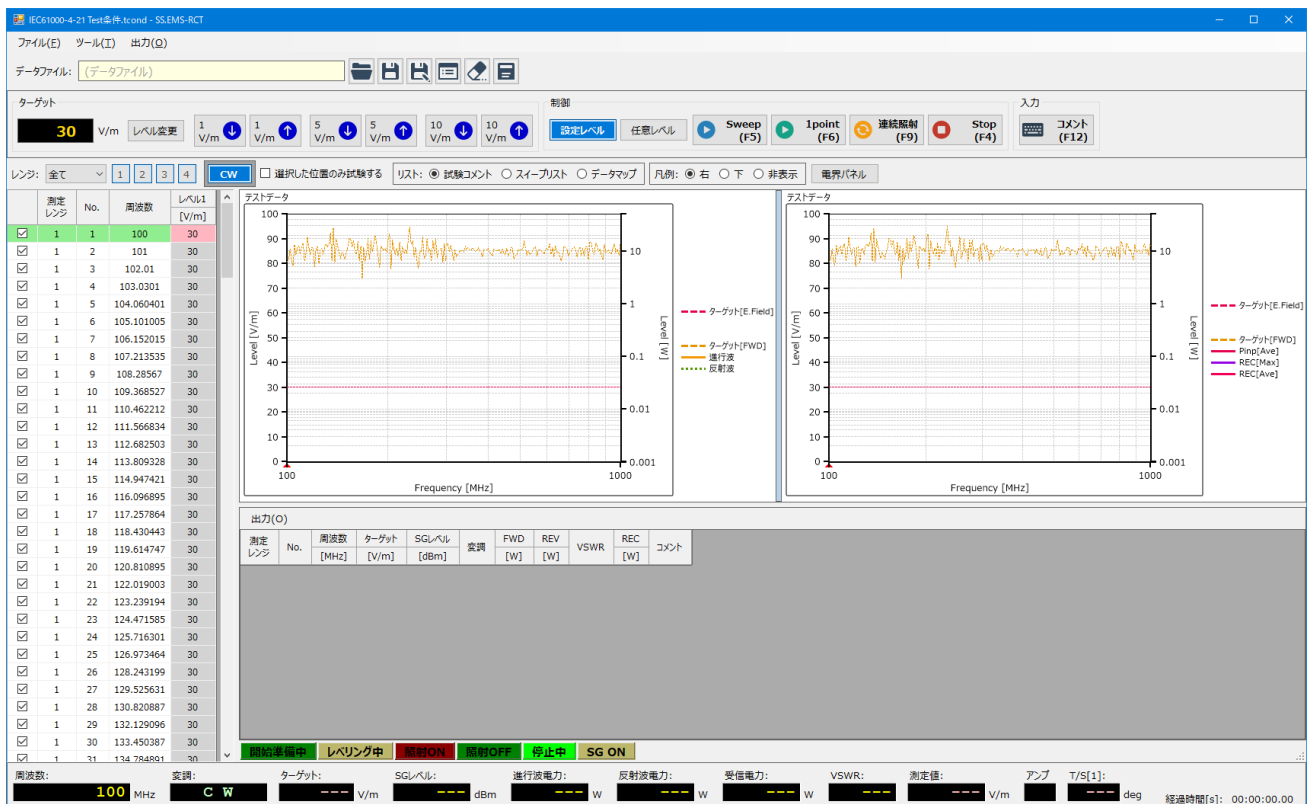


【TEST】を選択します。

[ファイルパターン]から選択 → 条件ファイルを選択してから【実行画面へ】をクリックします。

[データファイル]から選択 → TEST データファイルを選択してから【実行画面へ】をクリックします。

2.2 画面構成



データファイル: (データファイル)



TEST データファイルを保存する際に使用します。

測定条件の変更も行えます。(一部制限があります)

■ターゲットレベルの設定

ターゲット

30	V/m	レベル変更	1 V/m ↓	1 V/m ↑	5 V/m ↓	5 V/m ↑	10 V/m ↓	10 V/m ↑
----	-----	-------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

ターゲットレベルの変更が行えます。

制御

設定レベル	任意レベル
-------	-------

変更したターゲットレベルで試験を行う場合は【任意レベル】を選択して行います。

■T/S 固定位置で試験する場合

☒ 選択した位置のみ試験する

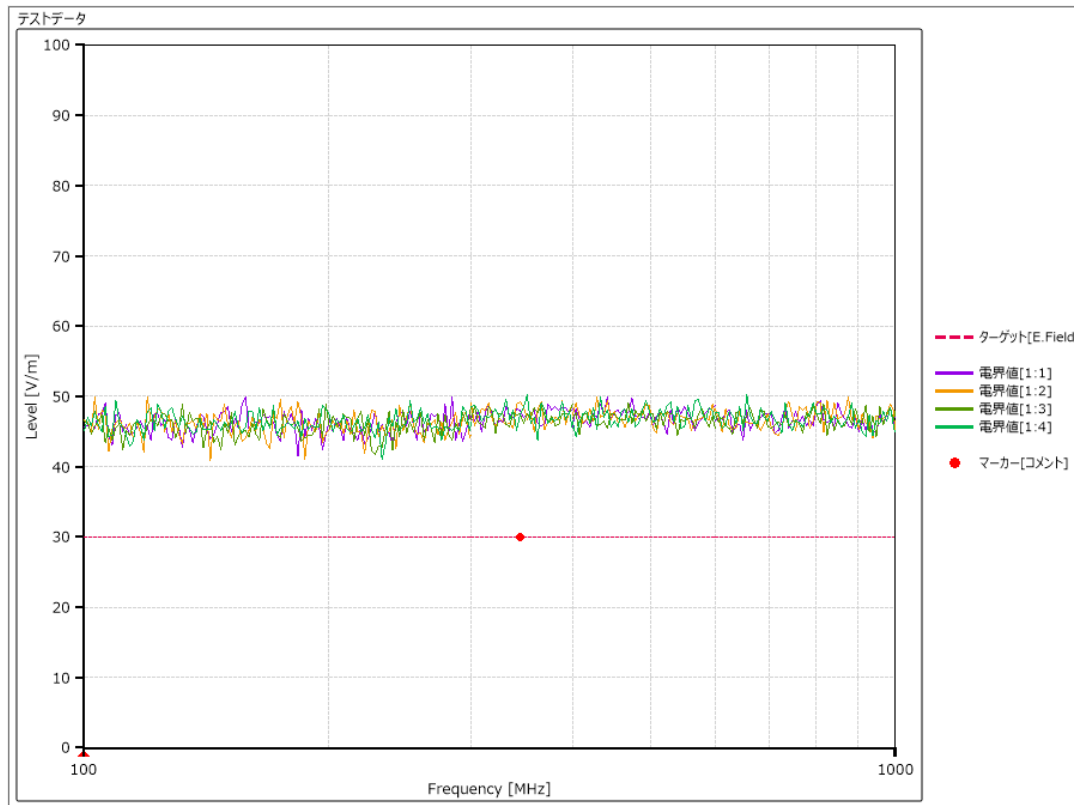
チェックを入れると T/S は選択した角度のみで周波数掃引を行います。

■全ての角度でレベリング（合わせ込み）を行う場合（IEC/ISO のみ）

☒ 全ての位置でレベリングを行う

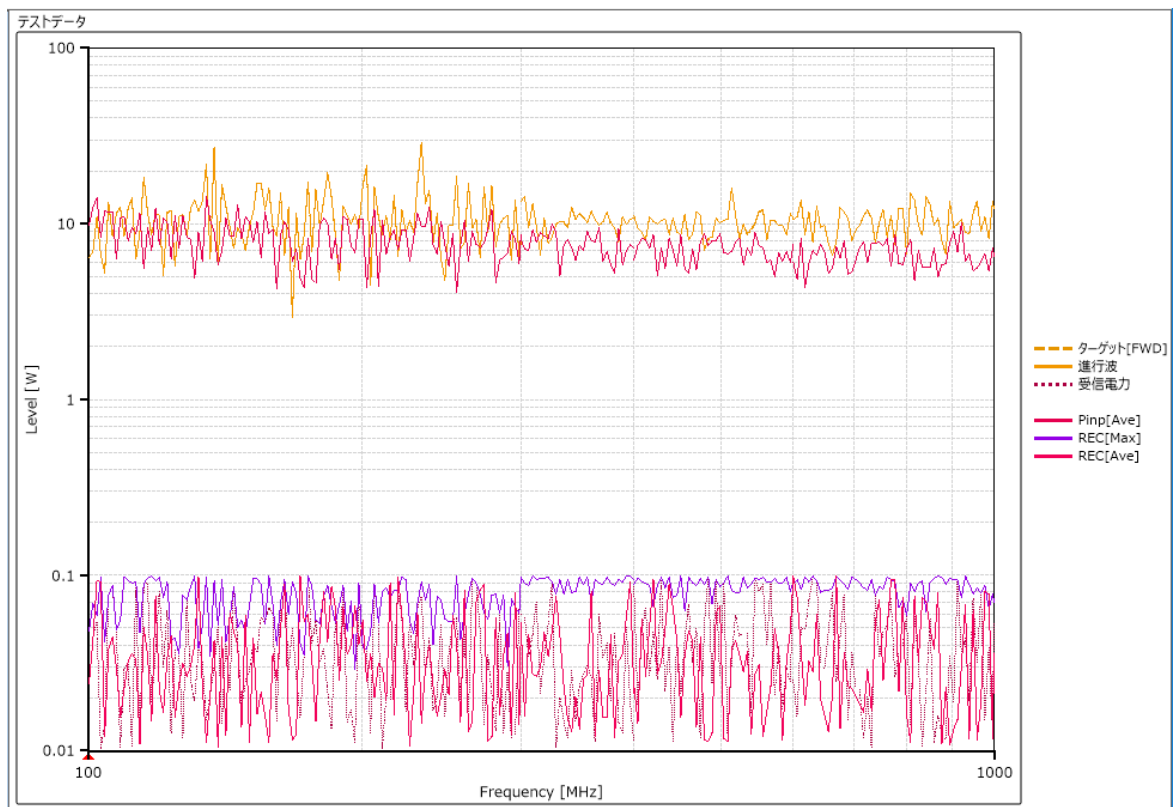
チェックを入れると全ての T/S 角度でレベリングを行います。

チェックが入っていない場合は、試験を開始した角度でのみレベリングを行います。



電界グラフを表示します。(左)

試験コメントを入力した場合はこちらにマーカー表示されます。



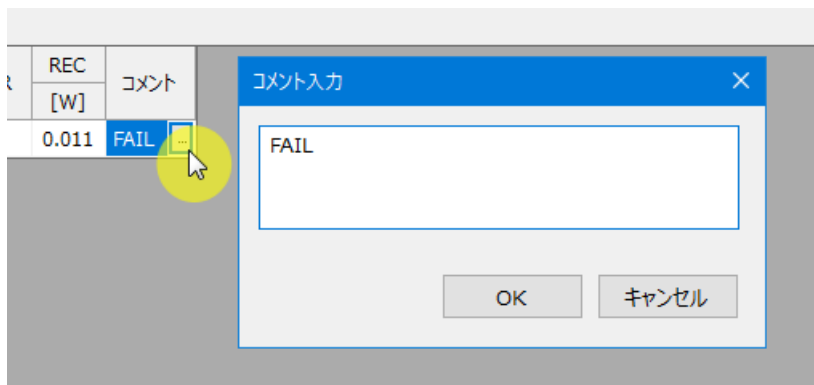
電力グラフを表示します。(右)

■試験コメント

リスト: ☒ 試験コメント ☐ スイープリスト ☐ データマップ

出力(O)											
測定レンジ	No.	周波数 [MHz]	ターゲット [V/m]	SGLレベル [dBm]	変調	T/S[1]	FWD [W]	REV [W]	VSWR	REC [W]	コメント
2	15	344.8423	30	-32.624	CW	108	10.641	0.013	1.1	0.011	FAIL

試験コメントを選択するとリスト表示部に試験コメントが表示されます。



コメント内容はボタンクリックにより編集ができます。

■スイープリスト（結果リスト）

リスト: ☐ 試験コメント ☒ スイープリスト ☐ データマップ

出力(O) 表示(V)

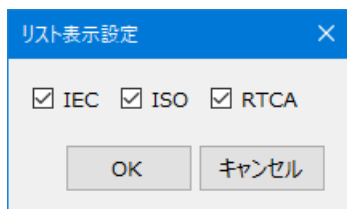
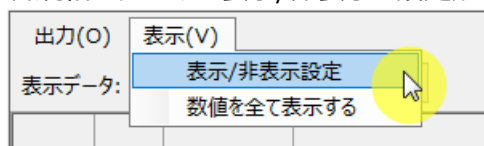
表示データ: 結果リスト

出力(O) 表示(V)														
表示データ: 結果リスト														
測定レンジ	No.	周波数 [MHz]	マーカレベル [V/m]	FWD [W]	リファレンスデータ									
					CLF	IEC		ISO		Tp,min [μsec]	E[Max] [V/m]	FW		
						Pinp[Ave] [W]	REC[Ave] [W]	<E>	CLF	G-RC	F-CLF			
1	1	100	30	6.436	7.709	0.045	11.039	1.445	0.006	11.039	0.692	0.015	9.641	...
1	2	101	30	6.875	7.762	0.057	10.855	1.401	0.007	10.855	0.714	0.019	9.856	...
1	3	102.01	30	10.864	14.931	0.056	8.962	1.304	0.004	8.962	0.767	0.01	10.456	...
1	4	103.0301	30	6.703	5.193	0.034	8.757	2.217	0.007	8.757	0.451	0.017	10.023	...
1	5	104.060401	30	5.258	6.028	0.046	10.431	1.006	0.007	10.431	0.501	0.018	10.538	...

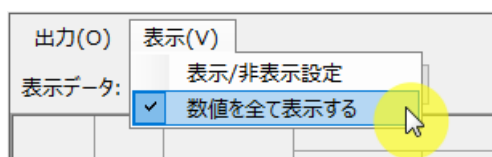
スイープリストを選択し【結果リスト】を選択するとリスト表示部にスイープリストの結果リストが表示されます。

※リスト項目の詳細は【RCU/RCT 用語集】を参照ください。

各規格パラメータは表示/非表示の設定が可能です。



表示する場合はチェックを入れます。



数値を全て表示するにチェックを入れるとリストの表示される数値が小数点で丸めない形式で表示されます。
計算値を検証する場合に使用します。

測定 レンジ	No.	周波数						
			マーカレベル	FWD	CLF		<E>	
		[MHz]			Pinp[Ave]	REC[Ave]		
			[V/m]	[W]	[W]	[W]		
1	1	100	30	6.43576236837642	7.7090346906443	0.0448022680412866	11.0389378319094	1.44468577
1	2	101	30	6.87543214040846	7.76247116628692	0.0566108922633216	10.8553750067024	1.40129068
1	3	102.01	30	10.8642562361706	14.9313817777069	0.0555648312837126	8.96193510469178	1.30350990
1	4	103.0301	30	6.70347509172732	5.19278091540883	0.0340408189701001	8.75721748954222	2.21735740
1	5	104.060401	30	5.25775082256694	6.92787431274517	0.0458352917438189	10.4313128771465	1.99581734

■スweepリスト（レベルリスト）

リスト: ☐ 試験コメント ☒ Sweepリスト ☐ データマップ

出力(O) 表示(V)

表示データ: レベルリスト

表示データ:レベルリスト

出力(O)		表示(V)							
		表示データ: レベルリスト							
測定レンジ	No.	周波数 [MHz]	T/S[1]	FWD [W]	REV [W]	Pinp [W]	Prev [W]	REC [W]	Position [V/m]
1	1	100	0	9.43	0.014	7.49	0.014	0.018	44.58
1	1	100	72	6.467	0.01	5.137	0.01	0.01	45.6
1	1	100	144	6.451	0.024	15.056	0.024	0.048	44.64
1	1	100	216	6.451	0.031	2.839	0.031	0.011	39.05
1	1	100	288	6.451	0.06	18.231	0.06	0.030	30.05

Sweepリストを選択し【レベルリスト】を選択するとリスト表示部に測定の全データを表示されます。

データ数によって表示に時間がかかる場合があります。

※リスト項目の詳細は【RCU/RCT 用語集】を参照ください。

■データマップ

リスト: ☐ 試験コメント ☐ Sweepリスト ☒ データマップ

出力(O)				
測定レンジ	No.	周波数 [MHz]	T/S[1]	データ
1	1	100	0	○
1	1	100	72	○
1	1	100	144	---
1	1	100	216	---
1	1	100	288	---
1	2	101	0	○
1	2	101	72	○
1	2	101	144	---
1	2	101	216	---
1	2	101	288	---

データマップを選択するとリスト表示部に測定のデータ有無が表示されます。

データがある場合に ○ が表示されます。

2.3 試験の実行

(1) 試験を行う周波数の選択

	測定 レンジ	No.	周波数	レベル [V/m]	↑	ラ
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	100	30		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	101	30		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	3	102.01	30		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	4	103.0301	30		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	5	104.060401	30		

(2) 試験レベルの確認・変更

ターゲット

30 V/m レベル変更

1 V/m ↓ 1 V/m ↑ 5 V/m ↓ 5 V/m ↑ 10 V/m ↓ 10 V/m ↑

試験レベルを変更する場合は【レベル変更】または Up/Down ボタンで変更します。

ターゲット

20 V/m レベル変更

1 V/m ↓ 1 V/m ↑ 5 V/m ↓ 5 V/m ↑ 10 V/m ↓ 10 V/m ↑

変更したレベルで試験を行う場合は【任意レベル】を選択しておきます。

制御

設定レベル 任意レベル

(3) 試験開始ボタンをクリックする

Sweep (F5) 1point (F6) 連続照射 (F9) Stop (F4)

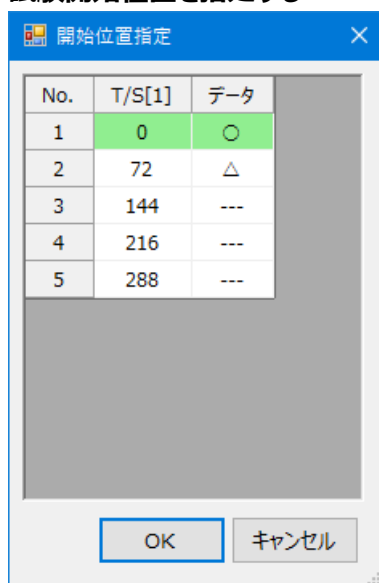
【Sweep】周波数掃引を行います。

【1point】選択中の周波数のみ試験を行います。

【連続照射】選択中の周波数のみ連続照射を行います。【Stop】ボタンをクリックするまで照射を続けます。

【Stop】試験を停止します。

(4) 試験開始位置を指定する



No.	T/S[1]	データ
1	0	○
2	72	△
3	144	---
4	216	---
5	288	---

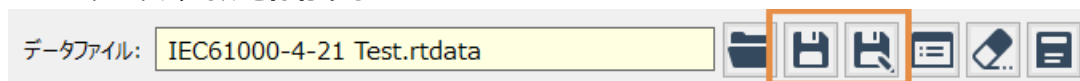
試験を行う位置を選択して【OK】ボタンをクリックします。

○：選択中のレンジの全ての周波数でデータがあります。

△：選択中のレンジ内でデータがある周波数があります。（データがない周波数がある）

---：選択中のレンジ内にデータはありません。

(5) TEST データファイルを保存する



データファイル: IEC61000-4-21 Test.rtdata

拡張子[.rtdata]で TEST のデータファイルを保存します。

必要に応じて印刷や PDF 出力を行います。

ソフトウェア取扱説明書	書 類 番 号	ページ
	SOM-EMS-16-00	12 / 12

■ ご注意

本書の内容の一部または全部を無断転載、無断複写することは禁止されています。

本書の内容およびソフトウェアの仕様について、将来予告なしに変更することがあります。

■ 商標について

Microsoft® および Windows® は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

National Instruments, NI, NI-VISA は、National Instruments Corporation の登録商標または商標です。
その他、各会社名・各製品名は各社の登録商標または商標です。

■ お問い合わせ先

・株式会社 TDN

TEL: 050-3634-5277

E-mail: info@td-n.co.jp